

# **ДОПОВІДІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР**

**Серія „А“**

**ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ  
ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ**

**ОКРЕМІЙ ВІДБИТОК**

**КІЇВ — 1985**

О. В. ЯЦЕНКО, М. О. СЕРГЕЄВ

**ФОТОРЕФРАКТИВНИЙ ЕФЕКТ У  $\text{LiNbO}_3$   
ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ЯМР  $^{93}\text{Nb}$**

*(Представлено академіком АН УРСР А. С. Бережним)*

Фотоіндукована зміна різниці показників заломлення (фоторефрактивний ефект), яка спостерігається в сегнетоелектричних кристалах  $\text{LiNbO}_3$ , до цього часу не має остаточного пояснення [1]. Більшість моделей, що описують це явище, зводиться до зміни показника заломлення незвичайного променя внаслідок електрооптичного ефекту, який збуджується макроскопічним внутрішньокристалічним електричним полем за рахунок розділення зарядів на межі освітленої зони кристала.

В роботі [2] показано, що при освітленні кристалів  $\text{LiNbO}_3$  з домішками Fe та Cu He—Ne лазером спостерігається зменшення розкиду параметрів тензора градієнта внутрішньокристалічного електричного поля (ГЕП) на ядрах  $^{93}\text{Nb}$ , яке виражається у зменшенні другого момента ( $S_2$ ) лінії ЯМР  $^{93}\text{Nb}$ . Оскільки у вихідному стані іони  $\text{Nb}^{5+}$  статистично розупорядковані [3], це свідчить про зменшення середнього зміщення іонів  $\text{Nb}^{5+}$  відносно їх кристалографічної позиції після освітлення зразка  $\text{LiNbO}_3$ .

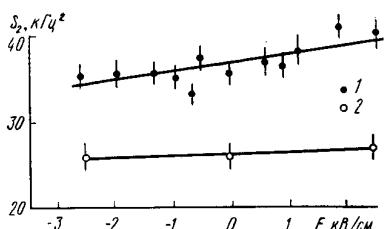
У повідомленні методом ЯМР широких ліній досліджується фоторефрактивний ефект у кристалах  $\text{LiNbO}_3$  з домішкою 0,005 % Fe (ваг. вміст). Використовувались монодоменні зразки об'ємом близько 1 см<sup>3</sup>. Через те, що головною причиною фоторефрактивного ефекту вважається виникнення макроскопічного внутрішньокристалічного електричного поля з  $\vec{E} \parallel \vec{C}$  ( $C$  — полярна вісь кристала), були досліджені залежності першого ( $S_1$ ) та другого моментів лінії ЯМР  $^{93}\text{Nb}$  переходу ( $\mp 1/2 \leftrightarrow \pm 1/2$ ) від напруженості зовнішнього електричного поля. Розрахунок моментів проводився відносно максимуму лінії поглинання ЯМР. Залежності  $S_2$  від  $E$  при  $\vec{E} \parallel \vec{C}$  як до, так і після освітлення зразка He—Ne лазером наведені на рисунку.

Згідно з [4] такому режимові освітлення для  $\text{LiNbO}_3 : \text{Fe}$  відповідає граничне значення  $\Delta n/n = 0,4 \cdot 10^{-4}$ . Таке ж значення  $\Delta n/n$  виникає за рахунок електрооптичного ефекту при  $|E| = 2,3$  кВ/см ( $\vec{E} \parallel \vec{C}$ ). Як видно з рисунка, у дослідженому діапазоні значень  $E$  макроскопічне електричне поле не може бути причиною спостережуваного після освітлення звужування лінії ЯМР  $^{93}\text{Nb}$ . Ефект перезарядження домішкових центрів  $\text{Fe}^{2+}$  та  $\text{Fe}^{3+}$  так само не може бути причиною зменшення  $S_2$ , бо значення  $S_2$  лінії ЯМР  $^{93}\text{Nb}$  переходу ( $\pm 1/2 \leftrightarrow \mp 1/2$ ) у бездомішкових зразках  $\text{LiNbO}_3$  та зразках з домішкою 0,005 % Fe (ваг. вміст) до освітлення практично однакові в ідентичних умовах експерименту. Перший момент  $S_1$  (зміщення центра ваги лінії ЯМР відносно максимуму лінії) в дослідженому діапазоні значень  $E$  також не змінюється, але, як і  $S_2$ , помітно зменшується після засвітлення кристала.

Вивчено залежність параметрів лінії ЯМР  $^{93}\text{Nb}$  від напруженості зовнішнього електричного поля при  $\vec{E} \perp \vec{C}$ . Спостерігалося збільшення  $S_1$  та  $S_2$ : при  $|E| = 250$  В/см значення  $S_2$  збільшувалося від 36,2 до 60,0 кГц<sup>2</sup> (середньоквадратична похибка — не більше 3,8 кГц<sup>2</sup>). Оскільки у вихідному стані іони  $\text{Nb}^{5+}$  статистично розупорядковані відносно їх кристалографічної позиції та не розташовані на осі симетрії третього порядку, дипольні моменти елементарних комірок кристала мають компоненти, перпендикулярні осі  $C$  ( $\sum_i \vec{p}_{i\perp} = 0$ ), які взаємодіють з зовнішнім електричним полем. Якщо  $\vec{E} \perp \vec{C}$ , це веде до збільшення середнього зміщення іона  $\text{Nb}^{5+}$  від

октаедрично координованої позиції та до зростаючого розкиду параметрів тензора ГЕП на ядрах  $^{93}\text{Nb}$ .

Що запобігти методичних помилок, було вивчено зміну форми лінії ЯМР  $^{93}\text{Nb}$  при безперервному освітленні зразка некогерентним світлом — лампою розжарювання з фокусуючою системою. Щільність потужності освітлення зразка була близько  $0,1 \text{ Вт}/\text{см}^2$ . Виміри проводились при короткозамкненому недіафрагмованому зразку, коротко-замкненому діафрагмованому (30 % освітлюваної грані — біля замикаючих електродів — затінено діафрагмою) та повністю освітленому розімкненому кристалі. Усі виміри, результати яких наведені в таблиці,



Залежність  $S_2$  лінії ЯМР  $^{93}\text{Nb}$  від напруженості зовнішнього електричного поля при  $\vec{E} \parallel \vec{C}$  до (1) та після (2) освітлення зразка  $\text{LiNbO}_3$  Не—Не лазером. Щільність потужності освітлення  $0,15 \text{ Вт}/\text{см}^2$ , час експозиції кожного елемента кристала — 30 хв.  $B_0 = 1,0 \text{ Т}$ ;  $\vec{B}_0 \parallel \vec{C}$ , де  $B_0$  — індукція магнітного поля

виконувались не раніше 90 хв після початку освітлення. Таким чином, проходження крізь кристал  $\text{LiNbO}_3$  фотоструму короткого замикання не веде до зміни  $S_1$  та  $S_2$  лінії ЯМР  $^{93}\text{Nb}$  (у такому режимі фоторефрактивний ефект не спостерігається), але фоторефрактивний ефект, який викликається некогерентним освітленням, супроводжується зменшенням  $S_1$  та  $S_2$  лінії ЯМР  $^{93}\text{Nb}$ .

Параметри лінії ЯМР  $^{93}\text{Nb}$  в  $\text{LiNbO}_3 : \text{Fe}$  (0,005 %, ваг. вміст) при освітленні зразка некогерентним світлом.  $\vec{B}_0 \parallel \vec{C}$ ;  $B_0 = 1,0 \text{ Т}$

Режим вимірювання	До освітлення	Короткозамкнений кристал	Діафрагмований кристал	Розімкнений недіафрагмований кристал
$S_2, \text{кГц}^2$	$37,9 \pm 1,5$	$37,6 \pm 1,4$	$28,4 \pm 1,2$	$25,7 \pm 1,4$
$S_1, \text{кГц}$	$-2,7 \pm 0,1$	$-2,8 \pm 0,1$	$-2,0 \pm 0,2$	$-1,9 \pm 0,2$

Можна вважати встановленим, що при невеликих щільностях освітлення фоторефрактивний ефект у  $\text{LiNbO}_3$  супроводжується упорядкуванням параметрів тензора ГЕП на ядрах  $^{93}\text{Nb}$  і відповідно зменшенням середнього зміщення іонів  $\text{Nb}^{5+}$  відносно їх кристалографічного положення. Це веде до зміни дипольних моментів елементарних комірок кристала та, завдяки цьому, до зміни спонтанної поляризації зразка.

Результати наших експериментів корелюють з залежністю зміни різниці показників заломлення  $\text{LiNbO}_3$  від орієнтації по відношенню до осі  $C$  вузької світлової смужки [5]. Зменшення  $\Delta n/n$  при орієнтації смужки вздовж осі  $C$  можна пояснити виникненням значної компоненти внутрішньокристалічного електричного поля з  $\vec{E} \perp \vec{C}$ , яка знижує ефект упорядкування іонів  $\text{Nb}^{5+}$ . Відзначимо, що у [5] для пояснення одержаних результатів була висунута модель, враховуюча зміну спонтанної поляризації кристала, але яка принципово відрізняється від за-пропонованої вище.

**SUMMARY.** Nuclear magnetic resonance of  $^{93}\text{Nb}$  into  $\text{LiNbO}_3$  is investigated. NMR line shapes of  $^{93}\text{Nb}$  before and after illumination are discussed. It is shown that optical damage is accompanied by a spontaneous polarization change due to regularization of  $\text{Nb}^{5+}$  positions into crystal lattice.

1. Леванюк А. П., Осипов В. В. Механизмы фоторефрактивного эффекта.— Изв. АН СССР. Сер. физ., 1977, 41, № 4, с. 752—770.
2. Yatsenko A. V., Shcherbakov V. N., Habuda S. P. NMR of  $^{93}\text{Nb}$  with quadrupole effects into doped  $\text{LiNbO}_3$  crystals: coherent lightning influence.— Sixth International Symposium on Nuclear Quadrupole Resonance Spectroscopy Abstracts. Moscow, USSR, 21—24 September, 1981, p. 103.
3. Yatsenko A. V., Shcherbakov V. N., Habuda S. P. Electrical Field Gradient Dynamic Changes on  $^{93}\text{Nb}$  into  $\text{LiNbO}_3$  experimental Determination. The connection with the optical damage.— Bull. of Magn. Reson., 1980, 2, N 1—4, p. 197—198.
4. Optikal Damage in Fe-doped  $\text{LiNbO}_3$ /Y. Ohmori, M. Yamaguchi, K. Yoshino, Y. Inuishi.— Jap. J. Appl. Phys., 1979, 18, N 1, p. 79—84.
5. Механизм фоторефрактивного эффекта в ниобате лития с железом / А. П. Леванюк, Е. М. Юкин, В. А. Пашков, Н. М. Соловьева.— Физика твердого тела, 1980, 22, № 4, с. 1161—1169.

Сімферопольський ун-т

Надійшло 03.07.84